**Zahtjev za snimanje uzoraka FE-SEM mikroskopijom /**

**analizu uzoraka EDS spektrometrijom**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | Pritisnite ovdje za unos datuma. |
| **Ime i prezime** |  |
| **Institucija/ Laboratorij** |  |
| **Telefon** |  |
| **e-mail adresa** |  |
| **Opis teme istraživanja** |  |
| **Broj uzoraka** |  |
| **Opis uzoraka** |  |
| **Vrsta analize** |  |
| **Vaša napomena**  **uz uzorke** |  |

**Opće napomene:**

Mikroskop, JEOL FE-SEM, model JSM-7000F, je visoko-vakuumski instrument i stoga zahtijeva pripremljene uzorke koji udovoljavaju sljedećim karakteristikama:

* moraju biti postojani u uvjetima visokog vakuuma
* ne smiju sadržavati vodu (H2O) ili druga otapala, te lako hlapljive tvari
* ne smiju sadržavati radioaktivne elemente
* ne mogu biti u tekućem stanju
* dimenzije krutih uzoraka ne mogu biti veće od 2 x 2 cm (fizički ne stanu u nosač mikroskopa)
* površina krutih uzoraka mora biti što ravnija, a debljina što tanja (planarni uzorci)
* svojstvo električne vodljivost uzoraka značajno utječe na uvjete snimanja, pa nevodljivi uzorci mogu zahtijevati posebne postupke pripreme prije snimanje uzoraka.

Popunjen zahtjev molim poslati na e-mail: [ristic@irb.hr](mailto:ristic@irb.hr)